

5-1-2-6 スルーホール欠け／通孔的缺口 / Missing Hole wall conductor of PTH

【特徴】 スルーホールランドの一部が欠けている状態の欠陥

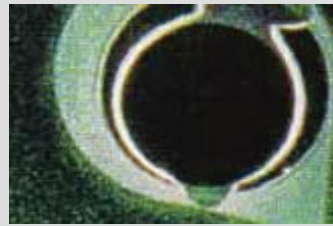
【特徴】 在焊环的局部有缺口形状的缺陷。

【Characteristics】 A part of the land of a PTH is fragmented.

【起因・判断ポイント・発生工程】 スルーホールランドが回路形成時に欠けたことにより出来たもの（回路形成工程）

【原因、判断要点、発生工序】 在图形转移时焊环就有缺口所引起的（图形转移工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 A part of the land of a PTH is fragmented by misalignment during imaging. (Imaging process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
ランドも欠けている
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
焊环的缺口
显微镜倍率 ×

【Comments】
Land is also
fragmented
Magnification: ×

5-1-2-7 スルーホールランド欠け／焊环的缺口 / Hole fragment

【特徴】 スルーホール内壁が一部無くなっている状態の欠陥

【特徴】 在通孔内壁的局部无铜的缺陷。

【Characteristics】 A part of the hole wall conductor of a PTH is lost.

【起因・判断ポイント・発生工程】 E Tレジストパターンとスルーホールとの相関位置ズレ、E Tレジストテンの破れや剥がれなどにより浸入したE T液にスルーホール導体が部分的に侵食されて出来たもの（E Tレジストラミネート～E T工程）

【原因、判断要点、発生工序】 由于ET图形与通孔的相关位置偏移、造成抗蚀膜破裂或者剥落等，入浸的ET液腐蚀通孔导线的局部所引起的（ET压合～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 A part of the hole wall conductor of a PTH is etched due to misalignment of resist pattern in imaging or broken dry-film tenting. (Dry-film lamination – etching process)



【コメント】
ランドも欠けている
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
焊环的缺口
显微镜倍率 ×

【Comments】
Land is also
fragmented
Magnification: ×



【コメント】
ランドも欠けている
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
焊环的缺口
显微镜倍率 ×

【Comments】
Land is also
fragmented
Magnification: ×